3C03

ペンタセン超薄膜の高分解能光電子スペクトル: 低温領域での膜構造変化およびホール-分子振動結合

 $(^{1}$ 名大物質国際研, ²千葉大工, ³名大院理)

山根 宏之¹, 永松 伸 $-^{2}$, 深川 弘彦², 解良 聡², 金井 要³, 関 一彦^{1,3}, 上野 信雄²

はじめに

ー般的な有機半導体結晶は弱いvan der Waals力によって集合しており、分子に緩く結合した π 電子が 電気伝導に関与する。分子間の π 電子の重なりが大きい場合、無機半導体に類似のエネルギーバンドが 形成され、バンド内で電荷移動が可能になる(バンド伝導)。一方、 π 電子の重なりが小さくなるとエネルギ ーバンドが形成されず、電荷は熱的に起こされた振動との相互作用で移動する(ホッピング伝導)。このよ うな有機デバイスの電荷輸送機構に関連した電子物性を調べる上で紫外光電子分光法(UPS)は直接的 かつ有効な手法である。一般的な有機半導体分子薄膜の UPS ピークは、バンド分散・フォノンとの結合・ ホールが膜中の場所により異なる安定化を受ける、といった要因から 400 meV 以上の幅を持って観測さ れてきた¹⁾。そのため、有機デバイス中のホッピング伝導に関する研究は電荷-振動結合による振動微細 構造が観測できる気相分子の UPS データが用いられてきた²⁾。一方、我々は表面不活性な高配向性熱 分解グラファイト(HOPG)基板上に高品質なフタロシアニン超薄膜を作製し、その最高占有軌道(HOMO) に対して精密な UPS 測定を行うことで、HOMO ホールと分子振動の結合による振動構造を検出すること に成功した³⁾。この構造は有機薄膜中のホッピング伝導を反映している結果であり、有機半導体薄膜の UPS データから直接的な議論を行うことが可能となった。

本研究では気相分子の良質な UPS データ²⁾ が得られているペンタセンの高度配向超薄膜を作製する ことに成功し、ペンタセン超薄膜中の HOMO ホール-分子振動結合に由来する UPS ピーク振動微細構造 を明瞭に検出した。また、86~162 K の温度領域において薄膜構造の変化に由来すると考えられる UPS ピーク形状・位置の連続的かつ可逆的な変化を観測した。

ペンタセン超薄膜の低温領域における連続的・可逆的な膜構造変化

図 1 にペンタセン超薄膜の真空準位(VL)および HOMO 領域の垂直放出条件 UPS スペクトルの温度 依存性を示す。横軸は基板の Fermi 準位基準の電子 の束縛エネルギーである。HOMO 領域において試料 温度 86~162 K で温度変化に伴った HOMOのピーク 形状の連続的・可逆的な変化を観測した。49, 298 K での HOMO のピーク差は 120 meV である。一方、VL は HOMO と逆方向にシフトし、そのシフト量は全体で 20 meV と非常に小さく、イオン化ポテンシャル(IP)が 室温相(5.68 eV)と低温相(5.82 eV)で異なる。この IP の違いはテトラセンで報告されているような薄膜構造 の温度依存性⁴⁾ によるものと考えられる。

次に 49 K の HOMO ピーク形状に注目する。ペンタ センの HOMO は単一の π 軌道からなるにも関わらず、 Brédas らによる気相 UPS スペクトル²⁾ と同様に少なく とも 3 つの成分を含んだ非対称な形状を示している。



図1: HOPG基板上に作製したペンタセン超薄膜の真空 準位(VL)およびHOMO領域における垂直放出条件UPS スペクトルの温度依存性.

この構造は分子振動がイオン化に伴い励起された構造、つまりホール-分子振動結合に由来する振動構造と解釈できる。詳細は後述するが、この構造を見ると、薄膜の UPS では気相の UPS より小さいエネルギー差で振動構造が現れ、その強度は気相の UPS よりも大きいことがわかる。

ペンタセン超薄膜中の HOMO ホール-分子振動結合

リニアカップリングモデルによれば振動構造の強度分布は ポアソン分布 ($I_n = S^n e^{-S}/n!$) に従う。Brédas らはペンタセンの 全対称(A_a)振動モードを上記モデルに適用することで気相 UPS の振動構造を良く再現している²⁾。本研究では Gaussian 成分(W_G)とLorentzian 成分(W_L)を含む Voigt 関数を A_e 振動 モードの重ね合わせに用い、薄膜 UPS の振動構造の再現を 行った。図2(a)は基板からの放出電子の寄与を除去したペン タセン超薄膜(49K)の角度積分 UPS スペクトル(UPS_{film}:0) と 気相ペンタセンの UPS スペクトル(UPS_{gas}:●)²⁾の HOMO 領域 を比較した結果である。振動構造の強度分布には UPSeasの 解析²⁾で得られた S 因子(S_{gas})と振動エネルギー(hv_{gas})を用い、 Voigt 関数の成分を $W_G = 5 \text{ meV}, W_L = 65 \text{ meV}$ とすることで、 文献2と同様にUPS_{gas}の振動構造を良く再現できた。図2(b) に示すように、UPS_{film}の裾構造は Voigt 関数の成分を変える $(W_G = 50 \text{ meV}, W_L = 90 \text{ meV})$ だけで良く再現できるものの、 振動構造の再現はできなかった。UPS_{film}の振動構造を再現 するには、全ての A_g 振動モードに対して S_{gas} を 1.2 倍、 hv_{gas} を 0.95 倍する必要があった [図 2(c)]。



図2:49Kのペンタセン超薄膜のHOMO領域の 角度積分UPSスペクトル()および気相ペンタ センのUPSスペクトル().(a~c)ペンタセンの 全対称振動モードおよびVoigt関数を利用した UPS振動微細構造のシミュレーション.

$$u_{h} = \frac{ea^{2}}{k_{B}T} \left(\frac{2\pi}{\hbar}\right) t^{2} \frac{1}{\sqrt{4\pi\lambda k_{B}T}} \exp\left(\frac{-\lambda}{4k_{B}T}\right) \cdots (1)$$

ホッピング伝導で決まるホール移動度 μ_h は式(1)で示すことができ、特に分子間重なり積分 t と再配向 エネルギー λ が重要である。ここで、UPS_{gas} から求められる分子内再配向エネルギーは $\lambda_{gas} \approx 2 = S_i hv_i$ で 与えられる。このモデルを薄膜系に適用すると、49-K UPS_{film} では $\lambda_{film} = 109$ meV (= 1.14 λ_{gas}) が得られ、 298-K UPS_{film} では $\lambda_{film} = 118$ meV (= 1.23 λ_{gas}) が得られた。式(1)を考慮すると、UPS_{gas}(または孤立分子 の量子化学計算) から間接的に見積もられる μ_h は、UPS_{film} から見積もられる μ_h より大きな値として得られる ことに注意しなければならない。この違いは薄膜における分子間のホール緩和(分極効果)が大きく寄与 していると考えられる。

参考文献

[1] K. Seki et al., Bull. Chem. Soc. Jpn. 47, 1608 (1974).; W.R. Salaneck, Phys. Rev. Lett. 40, 60 (1978).;
N. Sato et al., J. Chem. Soc. Faraday Trans. II 77, 1621 (1981).

[2] J.L. Brédas et al., Chem. Rev. 104, 4971 (2004).; O. Gunnarsson et al., Phys. Rev. Lett. 74, 1875 (1995).
[3] S. Kera et al., Chem. Phys. Lett. 364, 93 (2002).; H. Yamane et al., J. Electron Spectrosc. Rel. Phenom. 137-140, 223 (2004).; S. Kera et al., Surf. Sci. 566-568, 571 (2004).; H. Fukagawa et al., J. Electron Spectrosc. Rel. Phenom. 144-147, 475 (2005).

[4] A. Langner et al., Surf. Sci. 574, 153 (2005).